PAT-NO:

JP401141341A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01141341 A

TITLE:

BOTTLE BOTTOM INSPECTION INSTRUMENT

PUBN-DATE:

June 2, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

YOSHIDA, HAJIME

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HAJIME SANGYO KK N/A

APPL-NO:

JP62299417

APPL-DATE: November 27, 1987

INT-CL (IPC): G01N021/90

US-CL-CURRENT: 356/428

ABSTRACT:

PURPOSE: To inspect even a foreign matter consisting of a transparent material existing on the bottle bottom by placing a light shielding plate between the bottle bottom and a light source, and also, providing a cylindrical light reflecting plate so as to surround the outside of the light shielding plate.

CONSTITUTION: A light beam which is emitted from an illuminating lamp 4 is not made incident directly on a bottle bottom 1A since there is a light shielding plate 6 whose outside diameter is larger than the outside diameter of the bottle bottom 1A, but reflected by the inside peripheral surface 7A of a light reflecting mirror 7, and made incident diagonally toward the bottle bottom 1A from the lower side of the outside periphery of the bottle bottom 1A. Unless a foreign matter exists on the bottle bottom 1A, said light beam is reflected partially thereby and goes to the light shielding plate 6, but other part is refracted by the lower face of the bottle bottom 1A and goes into the bottle bottom 1A, refracted again by the upper face and advances to the diagonal upper part from the upper face of the bottle bottom 1A, passes through a drum part 1B of a bottle 1, and goes out to the outside of the bottle 1. On the other hand, when a foreign matter of a transparent material or an opaque material exists, the light beam goes into the bottle bottom 1A along an optical path L2, refracted thereby, and the light beam running along an optical path L4

separated from the upper face of the bottle <u>bottom</u> 1A is reflected by the surface 8A of a part of the foreign matter 8 and advances to the upper part, made incident on a sensor 2 through a bottle opening of the bottle 1 and existence of the foreign matter 8 is detected.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-141341

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)6月2日

G 01 N 21/90

A-7517-2G

審査請求 有 発明の数 1 (全6頁)

②特 顋 昭62-299417

20出 願 昭62(1987)11月27日

仰発 明 者 吉 田

肇 東京都千代田区九段南2丁目5番9号 九段三全ビル 肇

産業株式会社内

卯出 願 人 肇産業株式会社

東京都千代田区九段南2丁目5番9号 九段三全ビル

砂代 理 人 弁理士 伊藤 貞 外1名

明 粗 1

発明の名称 増脂検査装置

特許請求の範囲

選の増口の上方にイメージセンサを配置し、上記場の場底をその下方より光湖により照明し、上記場底を上記場口を通じて上記イメージセンサにより優映し、場底を検査する場底検査装置に於て、上記光源と場底との間に光学手段を設け、該光学手段により上記光源よりの光が上記場底に直接入別せず、その外側下方より所定の入射角を以って斜めに入射するようになしたことを特徴とする境底検査装置。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ガラス等の透明材より成る槽の底を 検査する壊胀検査装置に関する。

(従来の技術)

潤類、飲用又は薬用液等のガラスの如き透明材 より成る壜は、現状においては未だ多く利用され ていると言える。この中にあって、ピール増等の 酒類に用いられる場は、最終消費者の手に渡った 後、再び回収され、再利用されている場合が多く 見受けられる。この場合、回収された場は、工場 において充分な洗浄工程を経た後、ピール等の液 の充塡を行って、再出荷される。

然し乍ら、斯る団収壊は、新壜と異なり、複雑な波遷経路を長時間に渡って経てきているので、その間に、その口部が欠けたり、胴部に傷がついたり、地内に種々の異物が投入されたりして、再利用するには不適な不良堙となっているものも多くある。

そこで、最近では、イメージセンサー・電子処理機等を組合わせて、このような域の不具合を発見し、場が不良であることを示す信号を出力する空場検査機が皆及している。この従来の空場検査機の検査対象項目としては、主として逆の口部、胴部。底部の3個所がある。従って、従来の空港検査機は、これ等検査対象を夫々専門的に検査する別々の検査装置の組合せで通常構成される。こ

次に、上述した従来の透明な増の増駐検査装置の一例を、第4図を参照して説明する。第4図において、(I)は被検査物の一例である増、(2)は増(I)の口部の上方に配されたビデオカメラ等の知きイメージセンサ、(3)はセンサ(2)からの徴気信号を処

埋して、増(1)の良否の判定処理を行う電子処理機 である。次いで、壜(i)の増底 (iA) にある異物を センサ(2)に映像として映し出す為の光湖として、 照明灯似と例えば、すりガラスより成る円板状の 光拡散板(6)とを、増度(1A)の下方に第4関の如 く配置する。即ち、第4図に示す如く、堤(1)の中 心軸がイメージセンサ(2)の光軸(0-0)と一致 し、光拡散板(5)の板面は光軸 (0-0) に垂直 (増底 (1A) に略々平行)、その直径は増底 (1A) より大きく、その中心は略々光铷(0 - 0)上に 在り、照明灯(4)は、光拡散板(5)を介してのみ増胀 (1A) を下方より上方へ照明する。従って、この 場合、光拡散板(5)は、環底 (1A) に対し、あたか も平面的な二次照明板 (光源) の作用をなし、セ ンサ(2)には、均一な明るさを有する、増底 (1A) に対する明るい背景(明視野)として映る。従っ て、若し、増成 (1A) に不透明な異物が存在すれ ば、この異物を、上述の明るい背景(明視野)の 中の黒(嵴)い影としてセンサ(2)が捉え、これに 基づき、電子処理機団は異常の信号を発する。

(発明が解決しようとする問題点)

さて、上述の如き従来の壜底検査装置においては、 増底 (1A) に存在する異物が、上述の如く無いもの、即ち不透明、若しくは半透明なものであれば、センサ(2)が、これを増底 (1A) の明るい背形の中の影として捉えて、検出することは中の形としてが、例えばガラス破片、若は散板(5)よりの光はあるが、例えばガラス破片、光拡散板(5)よりの光は、外んど異物を通過してしまうので、かかる異物は形としても、極めて淡い影なので、検出することは困難であった。

従って、本発明は、異物が仮え透明なものであっても、これを検出し得る環底検査装置を提供せ んとするものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明によれば、壊(1)の増口の上方にイメージセンサ(2)を配置し、上記場の増底(1A)をその下方より光源(4,4A)により照明し、上記増底

(1A) を上記増口を通じて上記イメージセンサ(2) により撮映し、増版 (1A) を検査する増胀検査装 選に於て、上記光線 (4,4A) と増胀 (1A) との間に光学手段 (6,7,7A,9,9A) を設け、該 光学手段により上記光線よりの光が上記増底に直接入射せず、その外側下方より所定の入射角(1)を以って斜めに入射するようになした増胀検査装置が得られる。

(作用)

本発明による堪底検査装置においては、光欲(4 , 4 A) よりの光を、増底(1 A) に直接導入せず、その外側下方より斜め、即ち所定の夫々異る入射角を以って入射させるようになし、増底(1 A)をその下方より上方に通過する光も、増底(1 A)に対し、夫々異る傾斜を以って出射するようになし、増底(1 A)上に異物(B)が在る時は、増底(1 A)を通過した光が異物(B)のいずれかの表面で反射し、それ等反射光(又はその一部)が、増(L)の増口の上方に配置したイメージセンサ(2)により受光され

る。この時、イメージセンサ(2)は信号を出力し、これが選子処理機(3)に供給される。この電子処理機(3)は、イメージセンサ(2)より信号を受けた時のみ信号、即ち異物の存在を示す信号を出力する。一方、増底(1A)上に異物(8)がなければ、増底(1A)に入射した光湖(4 、 4A)よりの光の殆んど全べては、増(1)の嗣部(1B)を通じてその外側に進み、イメージセンサ(2)に到達しない。従って、イメージセンサ(2)は出力を発生せず、電子処理機(3)も出力を発生せず、増底(1A)は欠陥がないものと判断される。

(実施例)

本発明の主目的は、上述した如く、壊底の上に 在る透明材よりなる異物(被検査物)をも検査す ることである。透明材とはいえ、空気とは、その 光学的性質が異なるので、その表面に斜めに入射 する(垂直以外)光の一部は必ずそこで反射する。 この際、その入射角が大(全反射を起こす臨界角 より小さな入射角)であれば、その表面での反射 光の量が増加する。本発明は、上記光の特性を利用するものである。そのため、 遷底の下方よりこの環底に入射する光微よりの光の入射角を、 (となすと共に、 種々の値とない、 選底に入り、 屈折し、 そこより出る光 (及び は へ 入射した光と平行) が、 遷底上の透明材及で で は 小 で の 入射角 (0 ° よりは大 で あるが 臨界角よりは小なる角) を以って入射し、 そこで 反射され、 イメージセンサに到達し得る如くなす。

以下、上述した本発明による増度検査装置の一 実施例を、その略線図である第1図を参照して説明する。 尚、第1図に於て、第4図と対応する部分には同一符号を付し、それ等の詳細説明は省略する。

第1 図に示す本発明の例に於ては、増展 (1A) と照明灯又は光源(4)との間に、第4 図に示す従来 の光拡散板(5)の代りに、増展 (1A)の外径より大 なる外径で、不透明材より成る円板状の遮光板(6) を、光拡散板(5)と间様に、前両者と夫々離れて配

図すると共に、経断値が台形で、その小なる内径でも遮光板(6)の外径より大なる筒状の光反射板(額)(7)を、その中心軸が光軸(0-0)に略々一致し、遮光板(6)の外側をそれより離れて包囲する如く配設する。ここで、第1図に示す如く、光反射鏡(7)の大径の関ロが照明灯(4)側に配置されている。その他の部分は、第4図に示す従来例と略々同一である。

第1図に示す本発明の例に於では、照明灯(4)より発射された光は、増胀(1A)の外径より大なる外径の遮光板(6)があるので、増胀(1A)に直接入射せず、同図に於いて代表的に2本の光路(41)、(42)で示す如く、遮光板(6)の外側に配された光反射鏡(170の内間面(鏡面)(7A)に向う発散する如き光の部分がそこで反射され、増胀(1A)の外間下側より増胀(1A)に向って斜めに、即ち所にの入射角(0°よりは大きく全反射を起すといるの入射角(0°よりは大きく全反射を起すといるの入射力と、遮光板(6)の外径は増胀(1A)の外径より大に選択されているので、遮光板(6)は、第

4 図の光拡散板(5)とは逆に、イメージセンサ(2)に対して、境底(1A)を介して略々暗視野となる。 尚、鑑光板(5)の少くとも増底(1A)に対向する表面は、後述の理由により、光を可能な限り反射しないような、無反射処理を施し、不要な反射光が増底(1A)に再入射しないようにすることが望ましい。

第2図は、第1図の場(1)の場底(1A), 遮光板(6)及び光反射鏡(7)の一部の拡大図である。同図を参照して、第1図に示す本発明の場底検査装置の一例の動作を説明する。

今、壊底 (1A) に異物がないとすれば、第1図に示す照明灯(4)よりの光路 (22) に沿った光は、第2図に示す如く、光反射鏡(7)の鏡面 (7A) に入射角 (11) で入射する。そこで反射角 (r1) で反射された光は、光路 (L2) に沿って壊底 (1A) の下面に入射角 (i) で入射し、一部はそこで反射角 (r) で反射され、光路 (L3) に沿って遮光板(6)へ向うが、他部は壊底 (1A) の下面で避折して壊底 (1A) 内に入り、そこを進み、そ

の上面で再び屋折して、壊艦(1A)の上面より光路(L4)に沿って斜め上方へ進み、型に壊印の胴部(1B)を通過し、壊印の外側に出る。この時、光路(L2)及び(L4)は平行であるのは、周知の通りである。尚、光路(L3)に沿って進み、遮光板(6)に到る光は、上述した如く、その上面に無反射処理が施こされているので、そこで反射され、再び壊胀(1A)に向うことは、殆んどない。

扨て、本発明に於ては、第1図に示す如く、簡状の光反射銀(7)は、その緩断面が上方が小さな台形であるので、その銀面(7A)も間様形状の断面を有する。従って、銀面(7A)は、光軸(0 - 0)に平行ではなく、即ち銀面(7A)の延長線は、場底(1A)に直角とは異なる角で交わる。従って、光路(し2)に沿って増底(1A)に入射するく、といい、場底(1A)にその斜め下方より入射し、場底(1A)にその斜め下方より入射しに出て(光路(し4)に沿って進み)、イメージセン

サ(2)には到達しない。従って、異物がない場合は、 鑑光板(6)の作用により、イメージセンサ(2)は光を 全く受けないので、何等出力を発生せず、従って 電子処理機(3)も信号を全く発生しない。

一方、第2 図に符号(8)で示す如く、 遊底 (1A) 上に透明材及び或は不透明材等より成る異物が存在する場合は、 光路 (L2) に沿って遊底 (1A) の上面を離れる光路 (L4) に沿う光は、 異物(8)の一部の 表面 (8A) で反射 (入射角 (i2), 反射角 (r2)) し、同図の (L5) で示す光軸 (0-0) に略々 平行な光路に沿って上方へ進み、 第1 図に示す場(1)の場口を通じて、 その上方に配置したセンサ(2) に入射する。 従って、 センサ(2) は、 暗視野中に異物(8)よりの反射光を明るい光(光点)として捉え、 異物(8)の存在を検出し得る。

尚、この場合、光路(L2)に平行な他の光路 に沿って堪底(1A)を通過し、異物(8)の要面(8A) に入射する光は、この要面(8A)で反射し、その 反射光は、光路(L5)と平行な光路に沿って進

み、センサ(2)で捉えられる。又、光路(L2)に 平行ではないが、異物(8)の表面(8A)に入射し、 そこで反射される光でも、センサ(2)へ入射する光 は存在する。

尚、上述は主として光路(22)に沿って錐面

(7A) に人別する光に就いての説明であるが、、上述の如く、銀面(7A) は光軸(0-0)に関しての如く、銀面の説明であり、円板状の銀面であり、円板状のの説明の間には、間間には、間間には、1A) ので、その他の異る光も、それで加速に対し、ので、その他の異る光も、それで加速に対し、の一般に対し、なりされば、個人別では、一般に対し、との光質の異ないのというな異ないのと、これ等の光質のような異ないのと、このとのに対し、とのいずれかの知る。 使きずれば、 地底(1A)の上面で というな異物が在っても、そのいずれかのある。 使きずれば、 地底(1A)の上面で 光のような異物が在っても、 そのいずれかのある。 使きずれば、 地底(1A)の上面で 光

が反射し、反射光がイメージ(Nの対するように、光 域底 (1A) の全面に光が入射するように、光 反射鏡(17) (その鏡面 (7A)) 及び遮光板(5) の 域底 (1A) に対する形状、寸法及び両者の相互間の配 置及び壊底 (1A) に対する配置等を選ぶ。尚、第 2 図に於て、(N1), 及び(N2) は、光路(42), (L2) 及び(L4)に沿って北線を大々示す。尚、上述 む光の反射点に立てた法線を大々示す。尚、上述 む光の反射点に立てた法線を大々示す。尚、上述 は、 異物(8) の表面が鏡面の場合を例に挙げたが、この表面が相面であっても、光路(L5)方向に進む異る光路の光もこの相面で反射し、光路(L5)方向に進む光が増加するので、問題はない。

第3図は、本発明の他の実施例を示す略線図である。この第3図の例と第1及び第2図に示した例との相翼点は、主として、光潔と遮光手段とに在る。

即ち、第3図に示す本発明の例では、光源として環状灯(4A)を用いる。この環状灯(4A)は、その直径は、第1及び第2図の例と同様の遮光板

特開平1-141341(5)

(6)の直径より大で、この遮光板(6)の下方に配される。又、第3図の例では、図示の如く第1及び第2図の例の光反射銀(7)を使用しない代りに、遮光板(6)の外径よりやや大なる内径ではあるが、選状灯(4A)の直径より小なる直径の円形透孔(9A)を有する遮光板(9)を、第3図に示す如く、遮光板(6)と増底(1A)との間に、両者と離れて互に平行となる如く配置する。尚、円形透孔(9A)の中心は、光軸(0-0)上に在る。この第3図の例のは、光軸(0-0)上に在る。この第3図の例のよの他の構成は、第1図の例の構成と略々同一なので、間一業子には同一符号を付し、それ等の説明は省略する。

この第3図の例では、選択灯(4A)の直径及び 遮光板(9)の円形透孔(9A)の直径を、 壊底(1A) 及び遮光板(6)の両直径に対して上述の如く選択す ると共に、それ等の配置関係を上述の如く選択し、 環状灯(4A)よりの光が、両遮光板(6)及び(9)及び 円形透孔(9A)の作用により、第1図の例の光反 射鏡(7)の鎖面(7A)よりの反射光と同様な光路、 代表的には光路(L1)及び(L2)に沿って場

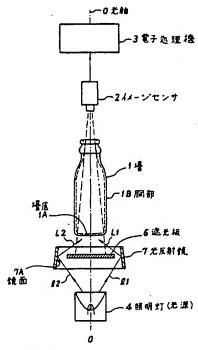
(発明の効果)

上述の如く、本発明によれば、従来の増展検査 装置よっては殆んど検査不可能な透明材より成る 機底上の異物をも確実に検出することができる。 図面の簡単な説明

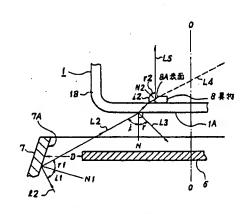
第1図は本発明による増貼検査装置の一例の略 線図、第2図はその一部の拡大図、第3図は本発 明の他の実施例の略線図、第4図は従来の増貼検 査装置の一例の略線図を夫々示す。

図に於て、(1)は増、(1A) は増底、(2)はイメージセンサ、(3)は電子処理機、(4), (4A) は光源、(6), (9)は遮光板、(7)は光反射鎖、(7A) は鏡面、(8)は異物を夫々示す。

代理人 伊藤 贞



本発明の一例の時線図 第 1 図



第1图の一部の拡大図 第2図

BEST AVAILABLE COPY

特開平1-141341(6)

